

## СВЕДЕНИЯ

Фамилия, имя отчество (полностью)	Егоров Николай Васильевич
Дата рождения (дд.мм.гггг), гражданство	19.12.1943г., РФ
Ученая степень и ученое звание (при наличии), отрасль наук	Доктор физико-математических наук, профессор
Шифр специальности, по которой защищена диссертация	05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы, структурное подразделение, должность, почтовый адрес, телефон, электронная почта	Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Заведующий кафедрой моделирования электромеханических и компьютерных систем. 198504, Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский просп., 35. Тел.: (812) 428 4235 e-mail: n.v.egorov@spbu.ru
Основные работы по профилю оппонируемой диссертации (не более 15 публикаций)	Публикации в изданиях, включенных в перечень ВАК (за последние 5 лет): <ul style="list-style-type: none"><li>• N.V. Egorov, A.Yu. Antonov, N.S. Demchenko. Statistical Simulation of Energy Spectra of Field Emission Electrons // Technical Physics. 2017. Vol. 62, № 2. P. 201-207.</li><li>• N.V. Egorov, E.P. Sheshin. On the Current State of Field-Emission Electronics // Journal of Surface Investigation X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques. 2017. Vol. 11, № 2. P. 285-294.</li><li>• N.V. Egorov, A.Yu. Gileva, L.I. Antonova, V.V. Trofimov, A.G. Karpov. Study of Optimum Conditions of a Vacuum Holographic Microscope // Journal of Surface Investigation X-Ray,</li></ul>

Synchrotron and Neutron Techniques. 2017. Vol. 11, № 2. P. 449-451.

- G.N. Fursey, N.V. Egorov, I.I. Zakirov, A.M. Yafyasov, L.I. Antonova, V.V. Trofimov. Peculiarities of the total energy distribution of field emission electrons from graphene-like structures // Journal of Communications Technology and Electronics. 2016. Vol. 61, № 1. P. 72-75.
- Egorov, N.V., Antonova, L.I., Karpov, A.G., Trofimov, V.V., Fedorov, A.G. Theoretical and Experimental Evaluation of the Electrical Parameters of a Holographic Microscope. Journal of Surface Investigation, 2020, 14(5), стр. 1061-10653.
- Vinogradova, E.M., Doronin, G.G., Egorov, N.V. Mathematical Simulation of a 2D Diode System with a Blade-Shaped Field Emitter. Technical Physics, 2020, 65(4), стр. 514-517
- Atomic Structure Probing of Thin Metal Films via Vacuum Holographic Microscopy Egorov, N.V., Antonova, L.I., Trofimov, V.V., Gileva, A.Y. Journal of Surface Investigation, 2019, 13(6), стр. 1267-1271
- Identification of Field-Emission Images as “Spotty Pictures” Egorov, N.V., Karpov, A.G., Klemeshev, V.A. Journal of Surface Investigation, 2018, 12(6), стр. 1200-1205
- Analysis of the Emission Characteristics of Field Cathodes Using Regression Models Egorov, N.V., Antonov, A.Y., Varayun', M.I. Journal of Surface Investigation, 2018, 12(5), стр. 1005-1012
- Book Chapter/ Carbon-based field emitters: Properties and applications Egorov, N.V., Sheshin, E.P. Topics in Applied Physics, Springer Series in Advanced Microelectronics 2020, 135, P. 449-528

Монографии (за последние 10 лет):

- Egorov N., Shehin E. Field Emission Electronics. – New York: Springer, 2017. – 578

	<p>р.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Егоров Н.В., Никифоров К.А. Некоторые проблемы моделирования систем на основе автоэлектронной эмиссии. – СПб: ВВМ, 2015. – 145 с.</li> <li>• Егоров Н.В., Е.П.Шешин Автоэлектронная эмиссия. Принципы и приборы. Интеллект, 2011. 704.</li> </ul> <p>Патенты, авторские свидетельства (за последние 10 лет): -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Егоров Н.В.( соавторы- Антонова Л.И. , Трофимов В.В. , Федоров А.Г.) Патент РФ №2492513 на изобретение голографический электронный микроскоп // 2013.</li> <li>• Егоров Н.В. (соавторы- Бедрина М.Е. , Куранов Д.Ю. , Семенов С.Г.) Патент РФ №2012132867 на способ изготовления твердотельного фотоэлемента на основе фталоцианина для преобразования световой энергии в электрическую // 2013.</li> <li>• Егоров Н.В.(соавторы- Антонова Л.И. , Трофимов В.В. , Федоров А.Г.) Патент РФ №117713 на устройство для получения голографической информации в низкоэнергетическом электронном микроскопе // 2012.</li> </ul>
Индекс Хирша	Scopus 10, WOS 3
Индекс цитируемости за последние 5 лет (по данным РИНЦ )	13